| | |
|---|---|
| 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第２－３部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 | C2814―２－３ |
| 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第２－４部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項 | C2814―２－４ |
| 電気機械用ブラシ材料の物理特性試験方法 | C2820 |
| 電気用銅材の電気抵抗 | C3001 |
| 電気用銅線及びアルミニウム線試験方法 | C3002 |
| 巻線通則 | C3053 |
| 横巻線 | C3204 |
| 電気機器用ビニル絶縁電線 | C3316 |
| 自動車用低圧電線 | C3406 |
| Ｘ線用高電圧ケーブル | C3407 |
| 自動車雑音防止用高圧抵抗電線 | C3409 |
| ＣＡＴＶ用（給電兼用）アルミニウムパイプ形同軸ケーブル | C3503 |
| 高圧架橋ポリエチレンケーブル | C3606 |
| ケーブルのコンクリート直接埋設工法 | C3650 |
| 電力用フラットケーブルの施工方法 | C3652 |
| 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 | C3653 |
| 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第１－１部：試験法総則―厚さ及び仕上寸法の測定―機械的特性試験 | C3660―１－１ |
| 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第１－２部：試験法総則―熱老化試験方法 | C3660―１－２ |
| 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第１－３部：試験法総則―密度測定の方法―耐水性試験―収縮試験 | C3660―１－３ |
| 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第１－４部：試験法総則―低温試験 | C3660―１－４ |
| 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第２－１部：エラストマーの特性試験方法―オゾン，ホットセット及び耐油試験 | C3660―２－１ |
| 電気・光ケーブルの絶縁体及びシース材料の共通試験方法―第３－１部：ビニルコンパウンドの試験方法―加熱変形試験―巻付加熱試験 | C3660―３－１ |
| 電気ケーブルの電気試験方法―第１部：450／750Ｖ以下のケーブル，コード及び電線の電気試験 | C3661―１ |
| 定格電圧450／750Ｖ以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第３部：固定配線用シースなしケーブル | C3662―３ |
| 定格電圧450／750Ｖ以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第４部：固定配線用シース付きケーブル | C3662―４ |
| 定格電圧450／750Ｖ以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第６部：エレベータケーブル及び可とう接続用ケーブル | C3662―６ |
| 定格電圧450／750Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル―第２部：試験方法 | C3663―２ |
| 定格電圧450／750Ｖ以下のゴム絶縁ケーブル―第３部：耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル | C3663―３ |
| 高圧がい管 | C3824 |
| 玉がいし | C3832 |
| 低圧ピンがいし | C3844 |
| 低圧引留がいし | C3845 |
| 可変速駆動システム（ＰＤＳ）―電磁両立性（ＥＭＣ）要求事項及び試験方法 | C4421 |
| 高圧受電用地絡継電装置 | C4601 |
| 高圧交流負荷開閉器 | C4605 |
| 電子機器用固定コンデンサ―第13部：品種別通則：固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデンサ | C5101―13 |
| 電子機器用固定コンデンサ―第13―１部：ブランク個別規格：固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデンサ　評価水準Ｅ及びＥＺ | C5101―13―１ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第14―１部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ　評価水準Ｄ | C5101―14―１ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第14―２部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ　安全性を要求する試験 | C5101―14―２ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第14―３部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ　評価水準ＤＺ | C5101―14―３ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第16部：品種別通則：固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ | C5101―16 |
| 電子機器用固定コンデンサ―第16―１部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ　評価水準Ｅ及びＥＺ | C5101―16―１ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第17部：品種別通則：固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコンデンサ | C5101―17 |
| 電子機器用固定コンデンサ―第17―１部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコンデンサ　評価水準Ｅ及びＥＺ | C5101―17―１ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第２－１部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィルム直流コンデンサ　評価水準Ｅ及びＥＺ | C5101―２－１ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第８部：品種別通則：固定磁器コンデンサ　種類１ | C5101―８ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第９部：品種別通則：固定磁器コンデンサ　種類２ | C5101―９ |
| 電子機器用固定コンデンサ―第９－１部：ブランク個別規格：固定磁器コンデンサ　種類２　評価水準ＥＺ | C5101―９―１ |
| オーディオ機器及びオーディオビジュアル機器―デジタルオーディオ部―音響特性の基本測定方法―第１部：一般事項 | C5533―１ |
| オーディオ機器及びオーディオビジュアル機器―デジタルオーディオ部―音響特性の基本測定方法―第２部：一般消費者用機器 | C5533―２ |
| オーディオ機器及びオーディオビジュアル機器―デジタルオーディオ部―音響特性の基本測定方法―第４部：パーソナルコンピュータ | C5533―４ |
| マイクロマシン及びＭＥＭＳ―第２部：薄膜材料の引張強さ試験方法 | C5630―２ |
| マイクロマシン及びＭＥＭＳ―第３部：薄膜材料の標準試験片 | C5630―３ |
| ディペンダビリティ管理―第３－６部：適用の指針―ディペンダビリティにおけるソフトウェアの側面 | C5750―３－６ |
| ディペンダビリティ管理―第３－７部：適用の指針―電子ハードウェアの信頼性ストレススクリーニング | C5750―３－７ |
| 干渉フィルタ通則 | C5870 |
| 位相子通則 | C5876―１ |
| 偏光子通則 | C5877―１ |
| 光伝送用レンズ通則 | C5934 |
| 光伝送用半導体レーザ通則 | C5940 |
| 光伝送用半導体レーザ測定方法 | C5941 |
| 光伝送用発光ダイオード通則 | C5950 |
| 光伝送用発光ダイオード測定方法 | C5951 |
| 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第１部：総則 | C5952―１ |
| 光伝送用能動部品―パッケージ及びインタフェース標準―第10部：ＭＵ（Ｆ14形）コネクタ付20ピンＳＦＦ形光トランシーバ | C5952―10 |